

MICROSCOPE À FORCE ATOMIQUE (AFM)

FABRICANT : Bruker

MODÈLE : Multimode 8

Description

La Microscopie à Force Atomique (AFM) est une technique de microscopie qui permet d'étudier la topographie d'une surface. Pour ceci une pointe très fine (2 à 20 nm à son extrémité) balaye la surface de l'échantillon. Grâce à la détection des forces interatomiques entre la pointe et l'échantillon, une image 3D de la surface est alors reconstituée.

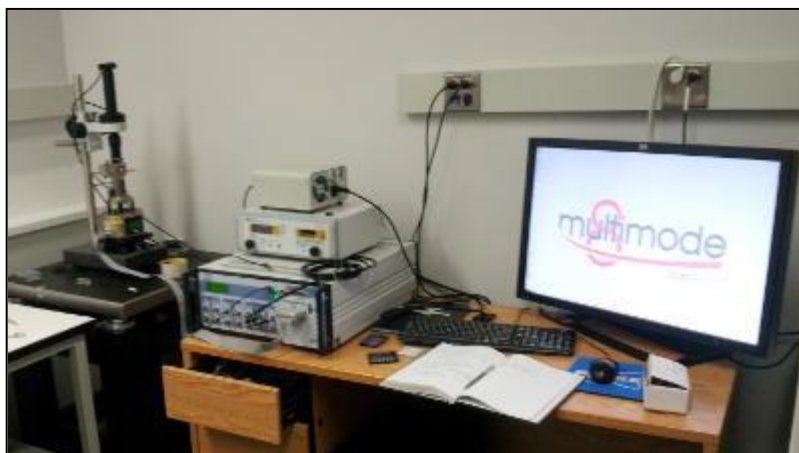
Le Multimode 8 est un AFM à très haute résolution dédié à l'étude des échantillons de petite taille (ADN, ARN, protéines). Il permet d'utiliser plusieurs modes opératoires (contact, tapping, peak force tapping) dans l'air et en milieu liquide.

Analyses

- Modes : contact, contact intermittent (Tapping), microscopie à force latérale (LMF), microscopie à force magnétique (MFM), microscopie à effet tunnel (STM)
- Mesures topographiques : quantitatif
- Mesure de propriétés viscoélastique : qualitatif
- Résolution latérale : 2 nm
- Contrôle de température : ≤ 185 °C (ambient); ≤ 60 °C (liquide)
- Cellule liquide

Applications

- Mesure en milieu ambiant ou liquide de la topographie, mesures des propriétés mécaniques, de friction, de rugosité, de gradient de champs magnétique, de gradient de champs électrique, de force d'interaction pointe/surface, électrochimiques



Microscope à Force Atomique (AFM), Bruker, MultiMode8